



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**



Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

tel.: 22 581 94 46, fax: 22 581 93 92, e-mail: radiation@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 08 stycznia 2018 r.

Nr świadectwa: L6-L62.4180.124.2017.4636.1

Strona: 1 / 2

**PRZEDMIOT
WZORCOWANIA**

Próbka materiału fotoluminescencyjnego – LunaGLOSSY® - płyta.

ZLECENIODAWCA

BOLD – Reklama, Poligrafia
Roman Kacperski
44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 11.

**METODA
WZORCOWANIA**

Metoda wzorcowania podana w Instrukcji wzorcowania materiałów fotoluminescencyjnych (pomiar luminancji i czasu zaniku fosforescencji) numer systemowy IW20-PR2.

**WARUNKI
ŚRODOWISKOWE**

Temperatura otoczenia: $(21,2 \div 21,4) ^\circ\text{C}$
Wilgotność względna: $(36,1 \div 37,2) \%$

**DATA WYKONANIA
POMIARÓW**

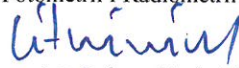
02 stycznia 2018 r.

**SPÓJNOŚĆ
POMIAROWA**

Wyniki wzorcowania materiału – materiał fotoluminescencyjny o nazwie LunaGLOSSY® - płyta, zostały odniesione do państwowego wzorca światłości poprzez zastosowanie wzorców światłości nr HA 1005B i HA 1006B o temperaturze barwowej 2353 K, oraz rozpraszacza wzorcowego firmy EG&G nr 179.

**NIEPEWNOŚĆ
POMIARU**

Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie EA-4/02 M: 2013. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

z up. Prezesa GUM
K I E R O W N I K
Samodzielnego Laboratorium
Fotometrii i Radiometrii

mgr inż. Łukasz Litwiniuk

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Materiał fotoluminescencyjny o nazwie LunaGLOSSY® - płyta						
Czas	po 2 min.	po 5 min.	po 10 min.	po 30 min.	po 60 min.	po 120 min.
Luminancja [mcd/m ²]	1370,70	685,70	306,70	95,80	42,70	18,10
Obliczony czas po jakim luminancja świetlna próbki osiąga wartość graniczną 0,32 mcd/m² - 3525 min. Względna niepewność pomiaru luminancji nie przekracza 10%						

Warunki wzorcowania:

Pomiar luminancji świetlnej oraz czasu zaniku fosforescencji po naświetlaniu próbki lampą ksenonową o mocy 150W przez okres 5 min. z odległości 80 cm. Wartość natężenia oświetlenia na powierzchni próbki wynosiła 1000 lx. Pomiar wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92N-01256/02.

Sprawdził:

Kierownik Pracowni Wzorców
Fotometrycznych i Radiometrycznych

mgr inż. Grzegorz Szajna

Główny Urząd Miar (GUM) realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Jest instytucją najwyższej rangi w dziedzinie metrologii w Rzeczypospolitej Polskiej jako tzw. krajowa instytucja metrologiczna.

Podstawowym celem działalności Głównego Urzędu Miar jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich powiązania z międzynarodowym systemem miar.

Główny Urząd Miar, jako krajowa instytucja metrologiczna jest źródłem, od którego akredytowane laboratoria wzorcujące wywodzą swoją spójność pomiarową. Nadrzędna rola krajowej instytucji metrologicznej potwierdzona jest w międzynarodowym dokumencie ILAC-P10:01/2013 „Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów” oraz w dokumencie DA-06 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji pt. „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”. Wzorce GUM, do których są odnoszone wyniki wzorcowań (informacja o spójności pomiarowej zamieszczona na pierwszej stronie świadectwa) są powiązane z wzorcami laboratoriów europejskich i światowych krajowych instytucji metrologicznych poprzez udział we wzajemnych porównaniach wzorców lub/i poprzez wzorcowania przeprowadzone w tych laboratoriach.

Laboratoria wzorcujące GUM mają wdrożony system jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.